

慢波系統參量 的測量方法

Х. И. Спектор

Методы измерения параметров

замедляющих систем

本书是测量慢波系统参量和特性——色散特性、耦合阻抗、匹配程度和衰减——的参考资料。书中广泛搜集了1957年以前科技期刊上所发表的有关材料，也采用了内部报告中以及作者未发表的研究成果。

本书可供从事超高频电子管的慢波系统测量和研究的科学工作者使用，对超高频电子器件专业的教师及高年级学生也有一定参考价值。

本书是由周工展、王恩岐和房正明译校的，李焯、贾学标、黄国平也参加了校订工作。

慢波系统参量的测量方法

作者：Х. И. 斯彼科托尔

译者：“国外电子器件”编辑组

印刷：北京市印刷一厂

一九六三年九月

7.6081
120

目 录

譯 者 序
簡 介
引 言

第一章 測量慢波系統色散特性和場分布的方法

§ I-1. 总述	1
§ I-2. 活动有功探針法	2
§ I-3. 活动无功探針法	7
§ I-4. 活动短路法	8
§ I-5. 諧振法	11
§ I-6. 測量色散特性曲綫的各种不同方法的比較及其应用范围	12
§ I-7. 通頻带边界的測定	13
§ I-8. 研究慢波系統中場分布的方法	14
§ I-9. 測量色散特性曲綫和慢波系統中的場分布的設備	15

第二章 慢波系統耦合阻抗的測量

§ II-1. 总述	22
§ II-2. 小扰动体法	23
§ II-3. 大扰动体法	28
§ II-4. 探針法	36
§ II-5. 耦合阻抗測量方法的比較及其发展远景	43

第三章 慢波系統匹配程度的測量

§ III-1. 总述	45
§ III-2. 变頻法	45
§ III-3. 相移法	47
§ III-4. 无反射負載法	48
§ III-5. 反射补偿法	48
§ III-6. 活动短路法	49
§ III-7. 关于加載慢波系統的探針測量	50
§ III-8. 关于电压駐波系数測量过程的自动化	52
§ III-9. 慢波系統匹配程度測試方法的应用范围及其发展远景	53

第四章 慢波系統中衰减的測量

§ IV-1. 总述	54
§ IV-2. 短路法	54
§ IV-3. 探針法	57
§ IV-4. 无負載品质因数法	60
§ IV-5. 衰减系数測量方法的評價及其应用范围	61

結 束 語

参考书刊

第 一 章

測量慢波系統色散特性和場分布的方法

§ I-1. 总 述

色散特性，即波的相速 v_{Φ} 与频率 f 的函数关系，是慢波系統最重要的特性之一。这个关系或者是直接表示，或者是通过与 v_{Φ} 有关的一些量，例如相位常数 β ，系統一个单元（节距）的相移 φ ，慢波系数 $m = \frac{c}{v_{\Phi}}$ (c 为光速)，以及系統中的波长 λ 来表示。通常这些关系不是表示成频率的函数，而是表示成自由空间中波长的函数。

現在我們写出上述各量之間的联系，因为以后我們还要用到它們。

$$\beta = \frac{\omega}{v_{\Phi}}, \quad (\text{I.1})$$

式中， $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi c}{\lambda}$ 为角频率，

$$\varphi = \beta \cdot L = \frac{\omega}{v_{\Phi}} L. \quad (\text{I.2})$$

式中， L 为相邻二单元之間的距离（系統的节距），

$$m = \frac{c}{v_{\Phi}} = \frac{c\beta}{\omega} = \frac{\lambda\varphi}{2\pi L} \quad (\text{I.3})$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\varphi} \cdot L = \frac{2\pi v_{\Phi}}{\omega} = \frac{\lambda}{m}. \quad (\text{I.4})$$

知道了关系式 (I.1) — (I.4) 之一，就不难得出任意次空间諧波的类似关系式，只要記住，此时

$$v_k = \frac{\omega}{\beta_k} = \frac{\omega L}{\varphi + 2k\pi},$$

式中 k 为空间諧波的序号 ($k=0; \pm 1; \pm 2; \pm 3 \dots$)。

根据色散特性曲綫的形状可以很容易地确定色散的性质（大家知道， $\frac{dm}{d\lambda} < 0$ 称为正常色散，而 $\frac{dm}{d\lambda} > 0$ 称为反常色散），以及相速与群速的相互方向。前向諧波（群速与相速同向）永远符合于正常色散。在反常色散情况下，可能是前向諧波（当 $\frac{dm}{d\lambda} < \frac{m}{\lambda}$ ，即正反常色散时），也可能是反向諧波（当 $\frac{dm}{d\lambda} > \frac{m}{\lambda}$ ，即負反常色散时）。

根据单元之間耦合性质的不同，各种慢波系統具有不同的色散性质和不同的色散特性曲綫形状。知道了色散性质就可以推測該慢波系統在具体器件中实际运用的可能性。例如，为了設計一个返波管型的振盪器，慢波系統必須具有負反常色散，色散特性曲綫 $m(\lambda)$ 應該有足够大的斜率（为了保証在一个频率上稳定地工作）。

对于寬頻带放大器來說則相反，色散特性曲綫 $m(\lambda)$ 必須尽可能平坦并且应具有正常色散。此外，色散特性也可以确定工作頻带和所要求的恒定電場和恒定磁場强度的比值，电子注的运动速度与此比值有关。

目前发表了大量的有关计算各种慢波系统色散特性曲线的文献[例如2, 3, 4, 14, 15], 但是所有这些文献还不能包括我们在实践中所碰到的各种不同的慢波系统。

此外, 还必须指出, 所有这些计算在某种程度上都是近似的。在某些情况下, 由于慢波系统的结构的复杂性, 使得计算或者是变得非常繁杂, 或者是只能给出粗略的近似结果。

因而, 为了有成效地研制采用慢波系统的电子器件, 必须具有能够十分精确而且迅速地测量各种慢波系统色散特性曲线的方法和设备。

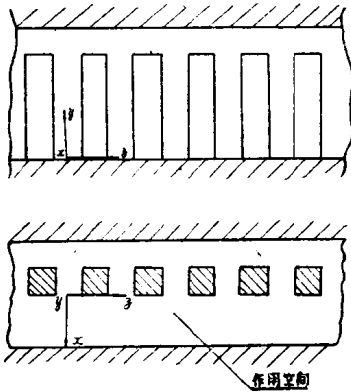


图 1 指型慢波系统中坐标轴的选择

除色散特性外, 了解慢波系统中的场分布也具有重大的意义。特别重要的是要知道电场在作用空间内沿三个坐标轴(图 1)的分布情况。在离开慢波系统的不同距离上, 沿 z 轴(图 1)测量场的分布, 可获得关于高次空间谐波场的强度的概念。精细地研究场分布图形有助于解决与输出结构耦合的阻抗变换器和管内负载(局部衰减器)的最佳结构的问题, 以及获得波在慢波系统中的传播性质的概念。

由于测量色散特性曲线和测量场分布的方法和设备在某些情况下有许多共同的地方, 故在本报告中将它们并为一章来叙述。

需测量的慢波系统模型可能是圆柱形的, 也可能是平面形的。这样便使得测试方法特别是测试设备也不相同。下面我们将叙述测量色散特性曲线和场分布的方法, 同时也简要地叙述一下所用的设备及其主要特性。

§ I-2. 活动有功探针法

众所周知的活动有功探针法是测量色散特性曲线时应用得最普遍的方法。

这种方法是以前用探针测量场分布图为基础的, 探针上的电动势在整流之后可以直接加到某一指示仪表上。由此得出“有功探针”的名称而与不作为电动势源的“无功探针”相区别(见下节)。

场分布的测量在驻波状态下进行。如果所研究的慢波系统是首尾相接的闭合系统的话, 则它将在这种驻波模式上谐振, 即沿着系统具有整数个波或者具有 2π 弧度的整数倍的相位变化的驻波模式。大家都知道, 这些驻波模式的数目为 $(\frac{N}{2} + 1)$, 此处 N 为系统的单元(节距)的数目。这些驻波模式就确定了慢波系统的通频带。在一个单元上的相移 $\varphi = \pi$ (π 模) 相应于通频带的一个边界, 而 $\varphi = 0$ (零模, 在这种情况下, 所有的单元均同相地驻波) 相应于通频带的另一个边界。如果慢波系统从两端短路, 则驻波模式的数目将为 $(N + 1)$, 因为在这种情况下, 谐振的条件是沿系统具有整数个半波长 (π 弧度)。每一个驻波模式与色散特性曲线上的一确定点相对应。这样一来, 在驻波状态下, 色散特性曲线具有不连续性质。如果慢波系统是无限长的, 或者是在行波状态下工作, 则可能的相移数目也是无限多的。这就是说, 色散特性曲线具有连续性质, 其中包括在驻波状态下所测得的那些非连续点。

为了确定一个单元上的相移, 必须在谐振频率上测量沿系统的总的相位变化(这个变化总是等于 π 弧度的整数倍), 而后用单元数 N 除, 那么,

$$\varphi = \frac{\pi}{N} \quad (I.5)$$

数 n 根据場分布图(图2)中最大值(場分布图中的“花瓣”)的数目来确定。但是,这时必須注意到下述情况。

在均匀传输綫(例如波导)中,如果說駐波图中每一个“花瓣”的宽度是正好等于 $\frac{\lambda}{2}$,則正如对場的探針測試图的分析所表明的,在周期结构中,上述关系远不能在所有的振盪模式上都成立。这个現象的簡單解释如下:通常,在周期结构中,金属表面和隙縫相互交替出現,电場的电力綫应该起始和終止于金属表面上(例如在指的表面上,见图2)。

这样一来,就与均匀綫不同,电力綫“宽度”改变的可能性在某种程度上受到限制。如果相移 φ 是 π 的倍数($\varphi = \pi, 0.5\pi, 0.25\pi \dots$),則場“花瓣”的宽度正好等于 $\frac{\lambda}{2}$ (图2, $\varphi = \pi$)。如果 φ 不是 π 的倍数,則从图2б, в, г*可以看出,某些“花瓣”的宽度可能小于 $\frac{\lambda}{2}$,而另外一些大于 $\frac{\lambda}{2}$ 。

場分布的另一个重要特征是場“花瓣”的幅度調制(图2б, в, г)。这个現象同样也是由于 φ 在大多数情况下不是 π 的倍数而引起的。例如,如果 $\varphi = 0.9\pi$ 时,最大場的相位在图2б的中心指上,則在其相邻的指上,場的振幅应该具有較小的值,因为要获得同样的最大值,必須使相移 $\varphi = \pi$ 才行,而离开中心的第二个指上場的振幅将更小等等,直到达到零值为止(或者是接近零值),这相当于探針測試图上出現两个寬“花瓣”的情况(图2б, в)。然后图象再次重复。

这样一来,在場的分布图中就有可能分辨出幅度調制的空間周期(在图2中用字母 L_m 表示)。每一个調制周期均包含整数个系統中的半波长。一个調制周期范围内“花瓣”的平均宽度正好等于 $\frac{\lambda}{2}$ (即相应于 π 弧度)。在“窄花瓣”上相位变化的不足为“寬花瓣”上相位变化的过剩所补偿。

由以上所述可知,如果根据一个或数个“花瓣”确定 φ ,則可能产生較大的誤差。例如,对于图2б所示的情况,可以获得 $\varphi = \pi$ 或者是 $\varphi \approx 0.67\pi$ 的值,而得不到真实值 $\varphi = 0.9\pi$ 。由整个探針測試图上取的“花瓣”越多,誤差就会越小。但是,在許多情况下,如果注意到下列事实,則有可能避免上面提到的誤差。

具有給定場分布的振盪模式,只有在沿被短路的慢波系統具有整数个調制周期的情况下才可能存在。例如 $\varphi = 0.9\pi$ ($L_m = 10L$)的模式可能存在于长度为 $10L, 20L$ 和 $30L$ 等系統中。由此可見,在被測系統的整个长度上計算“花瓣”的数目“ n ”能得出 φ 的正确值。但是,在实际情况下,系統中可能有各种不同的不对称(例如,激励装置的存在和慢波系統的不規則性等),由于这些不对称,某一个区域中的場分布就可能畸变。在这种情况下,为了計算“ n ”和“ N ”,最好是从場的整个探針測試图中取出一个或数个場畸变程度最小的調制周期。然

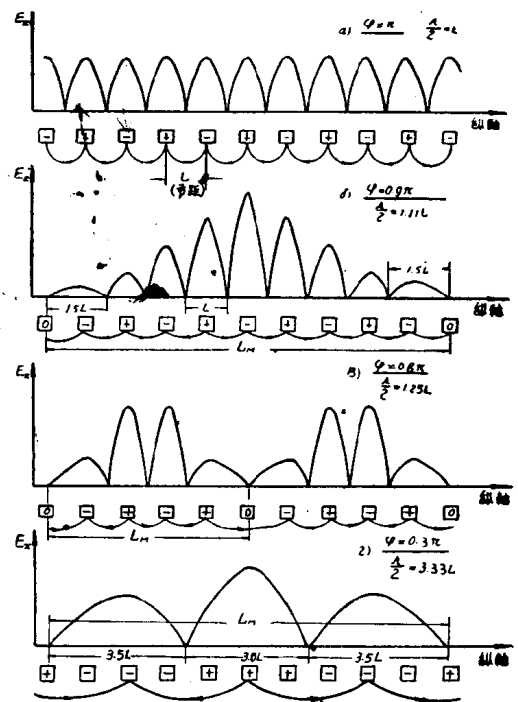


图2 不同相移 φ 情况下横向电场分量(E_x)的分布和电力綫的大概行程

* 图2中所示的电力綫的近似行程符合于用实验方法获得的場的横向分量的分布。这里仅给出了那些符合于指上負电荷和正电荷“中心”的电力綫(在某一瞬时)。

而，就是在这种情况下，也不能完全确信所得“花瓣”数目的正确性，其原因如下：第一，由于幅度调制(π 模式附近调制特别深)，探针不是在任何情况下都能测出很微弱的场的“花瓣”的。这一点可以从图3a上明显地看到，图中给出了两个场探针测试图，这两个探针图是在探针与指表面的距离不同时（其他条件相同）而测出的。第二，由于存在高次空间谐波，在基波的场分布图上就可能出现“多余的花瓣”，这种情况在图3b上可以清楚地看到，这个图是在探针很近($\delta/L=0.085$)和较远($\delta/L=0.85$)的两种情况下测出的。顺便指出，“花瓣”的这种破碎现象通常只有用其纵轴平行于指表面的探针（纵探针）才能得到。

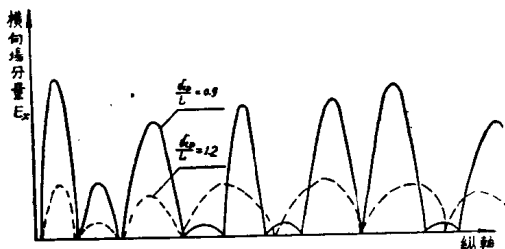


图 3a 横向电场分量的探针测试图与探针到慢波系统的距离的关系
(δ_{cp} —探针中心到慢波系统指面的距离； L —慢波系统的节距)

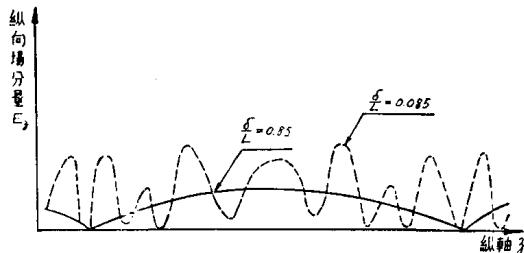


图 3b 纵向电场分量的探针测试图与探针到慢波系统的距离的关系
(δ —探针纵轴到慢波系统指面的距离； L —慢波系统的节距)

在实际的（不放大的）模型中使用横探针时，探针离开慢波系统的平均距离（按探针长度取平均）通常远大于放置纵探针处（有功的或无功的）至慢波系统的距离。与此相应，高次空间谐波只有在 $\frac{\delta_{cp}}{L}$ 值非常小的情况下才能出现，因为它们随着远离指面而变得越来越小，以致消失。

考虑到上述可能的场畸变，在某些情况下不根据“花瓣”的数目，而根据调制包络（自然，如果包络是明显可辨的话）来确定相移 φ 是比较适宜的。

对于 $\varphi < \pi$ 的相移而言，相位在每一个单元上的变化均比 π 小 $(\pi - \varphi)$ 弧度。因此就引起了系统各个指上振幅的差别。很明显，只有当在一系列连续的单元上，差 $(\pi - \varphi)$ 的总和达到 π 值时，与某个初始相位相应的振幅才将重复出现。这也是确定调制周期大小的条件。如果用字母 N_m 表示一个调制周期内的单元数目，则由上所述可得：

$$(\pi - \varphi) N_m = \pi \quad (I.6)$$

由此得出

$$\varphi = \left(1 - \frac{1}{N_m}\right) \pi \quad (I.7)$$

在 π 模的时候， $N_m = \infty$ 。这意味着调制不存在。随着 φ 的减小，调制周期逐渐减小，同时调制深度也逐渐减小（图 2b, e）。实际上这意味着，只有在 $\varphi > (0.75 - 0.8) \pi$ 的时候，才有可能清楚地分辨出调制周期。但是恰恰对于较大的相移，在计算场的“花瓣”时，会由于其数目太多而产生误差。

如果想用计算沿系统分布的调制周期数目来代替 N_m 的话，我们也可以推导出这时的计算 φ 值的公式。用字母 m 表示调制周期数，并将等式 (I.6) 两边乘以 m ：

$$(\pi - \varphi) N_m m = \pi m$$

考虑到 $N_m \cdot m = N$ ，则最后得出

$$\varphi = \left(1 - \frac{m}{N}\right)\pi \quad (\text{I.8})$$

按照公式 (I.8) 計算相移 φ ，要比用公式 (I.7) 簡單。

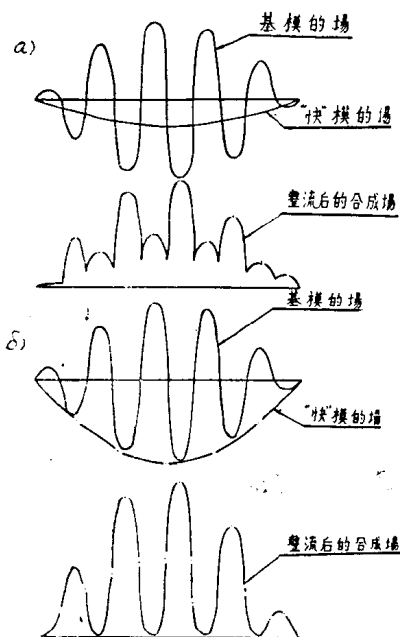


图 4 “快”振盪模式在基本振盪模式上的疊加 (横坐标轴为纵轴 z ，纵坐标轴为相对的場强)
a) “快”模振幅小于基模振幅；b) “快”模振幅等于基模振幅

測量色散特性曲綫时产生誤差的另一个可能来源，是在某些情况下激励了所謂“快”波，关于“快”波的存在在文献[12]中已經指出了。这种波的传播速度接近光速。如果“快”模的場較弱，則只有場“花瓣”的振幅发生变化以及节

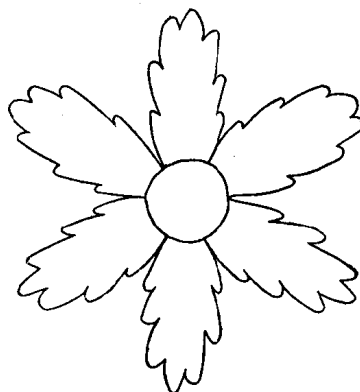


图 5 实验測得的表征强“快”模疊加的探針測試图

点脱离零位綫的情况 (图 4 a)，如果“快”模的振幅能与基本振盪模式的振幅相比拟，則会出现一部分“花瓣”消失的現象 (图 4 b)。图 5 所示为通过实验获得的場探針測試图，它表征非常强的“快”振盪模式的疊加情况。看来，“快”振盪模式是复杂双綫傳輸綫的一种波型，它可以在慢波系統表面与探針头金属表面之間形成。“快”振盪模式的出現带有諧振性质，即相当于沿該波型传播的路程上存在有整数个波 (对于非首尾相接的閉合系統來說是半波的整数倍)。例如，在图 5 所示的情况下，沿指型系統的表面，正好分布三个自由空間中的波长，与大“花瓣”的数目相对应。但是也有无法辨别振盪模式的情况，这就是两个或数个振盪模式互相“疊加”的情况。每一个分立的振盪模式都有自己的通頻带 Δf ，

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q} \quad (\text{I.9})$$

式中， Q 为該振盪模式情况下的无載品质因数， f_0 为其振盪頻率。

如果两个相邻振盪模式諧振頻率的差与 Δf 是同一个数量級，則将出现这两个振盪模式場的疊加現象。这种現象与色散特性曲綫的斜率 (諧振頻率之間的差)、单元数 (振盪模式数) 以及振盪模式的品质因数有关。色散特性曲綫斜率越大，单元数越大和品质因数值越小，都会使場結構的失真显得越强。特别是在通頻带的边界上这种現象最强烈。因此，为了更精确地測定色散特性曲綫的傾斜段，最好选用单元数目不太多的系統。

不言而喻，上述这种現象也适于其他不是該慢波系統所固有的振盪模式，例如，“快”振盪模式的疊加情况。由此得出結論，用改变单元数目的方法，能消除“快”振盪模式的干扰作

用。

造成误差的另一重要来源是慢波系统几何尺寸的不均匀性。它可导致：第一，电磁场结构的畸变；第二，局部的反射和辐射。后者能助长“快”波的激励[12]。实验表明，几何尺寸不均匀性的影响在相移较大的区域（或者说，在系统中波长较短的区域），以及相移快速变化的区域表现最强。在某些情况下，较大的几何尺寸不均匀性会加强相邻谐振模式场的叠加效应。这一点可以用因某些单元的“失谐”而引起整个系统品质因数的降低来解释。例如，我们发现，在经过仔细矫正的指状梳型慢波系统中，能够成功地测量几乎整个通频带内的相移。在同样尺寸的而未矫正的系统中，当 $q \geq 0.6-0.7$ 时，场的探针测试图就已经不能辨认了。

大家知道，在靠近通频带边缘的地方衰减急剧上升。如果系统尺寸不均匀，则某些单元的衰减便增加，这样自然就会引起整个系统衰减的增加。因此，慢波系统的明显激励只有在靠近能量输入端的不太大的长度上出现，这样实际上就排除了测定相移的可能性。

在正常的条件下，也就是“花瓣”数或调制周期能够精确数出的情况下，测量误差主要决定于系统调谐到谐振的精确度。该谐振模式的品质因数越高，就越可能精确地确定谐振。

在波长很短（3厘米或更短些）的情况下工作时，由于下列原因还可能产生一些附加困难。

1. 系统尺寸比探针尺寸小；
2. 获得尺寸很均匀的系统比较复杂；
3. 信号发生器的功率小；
4. 系统中的损耗大。

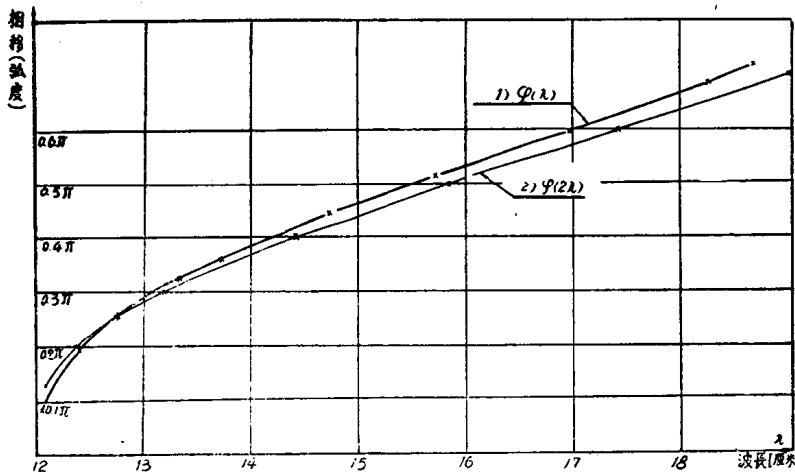


图 6 两种“交叉指”型慢波系统的色散特性曲线的比较
(二系统的尺寸比例为 1:2)

致的色散特性曲线。

图 6 所示是对“交叉指”型慢波系统的两个色散特性曲线进行比较的结果。曲线 2 表示全部尺寸缩小两倍的系统的色散特性曲线。看来，色散特性曲线的某些偏差（波长的最大偏差为 3%）可能是由测量误差和模型制造得不精确而引起的。

为了避免这些困难，有时采取将慢波系统模拟到较长波段上的方法。在计算色散特性曲线时所允许的误差范围内，这种模拟是可能的，因为慢波系统的色散特性只与单元的各线性尺寸间的比以及自由空间波长和尺寸之一的比（例如，在指型系统情况下与指高度的比）有关。

用实验方法检验的结果表明，模拟能获得很一

§ I-3. 活动无功探针法

活动有功探针法仅适用于在周期结构附近能够引进探针的慢波系统。然而，在周期结构附近引进探针不是在任何系统中都有可能的。例如，对于膜片波导或弯曲波导型的系统来说，实际上就不存在这种可能性。此外，在某些情况下，希望测量用无隙缝的金属壁从各个方向完全封闭的系统。在所有这些情况下必须借助于活动无功探针法。这种方法的实质如下。

沿着调到谐振的被研究的慢波系统空腔移动一个不大的扰动体。当该扰动体放置在场强为零的地方时，谐振状态不会被破坏。当扰动体放在场强不为零的地方时，则根据微扰理论（第8节中将更详细地叙述），将产生谐振腔的失谐现象。同时，场强越大，这种失谐就越厉害。谐振及其失谐现象可借助一个与晶体检波器连接的不大的耦合元件（耦合环或探针）来发现。当空腔调到谐振时，检波器输出端的信号最大。随着失谐程度增大，信号逐渐减小。

这样，就可以确定系统中的波长，或是与活动有功探针法一样，可以确定相移。

从这种测量方法的原理本身可以得出结论，其灵敏度与被测振荡模式的品质因数有关。品质因数越低，信号的变化就越小。扰动体一般是用损耗小的介质（聚苯乙烯，石英）作成圆柱体形，或者是用导电性能良好的金属作成圆柱体形。扰动体最好是用聚苯乙烯胶固定在细的卡普隆* 线上。第二节中所述的所有误差来源同样也适于活动无功探针法。但是对已提到的还应该补充两个可能成为附加误差来源的特点。首先，是正确地选择扰动体的形状和材料的问题。

对扰动体的主要要求*如下：

① 扰动体必须足够大，以便给被研究的谐振腔以明显的作用，也就是为了能够明显地观察到从耦合元件检波头上所取出的信号的变化。

② 扰动体应该主要是分离出一个场分量。

③ 扰动体的纵向尺寸应该比场“花瓣”的宽度小数倍。由于“花瓣”的最小宽度等于系统的一个节距（在 $\varphi = \pi$ 的情况下），所以，扰动体的长度应该小于系统的节距。

要满足这些要求，往往不得不寻找一些折衷的解决办法。看来，一个长度比其直径大 6—8 倍的细圆柱体主要是对电场的分量起作用，该分量的方向与圆柱体纵轴的方向相同（详见下面 § II—1）。

由于作用微弱，使用细而短的圆柱体和一般的测量设备进行测试，并不是在任何时候都是可

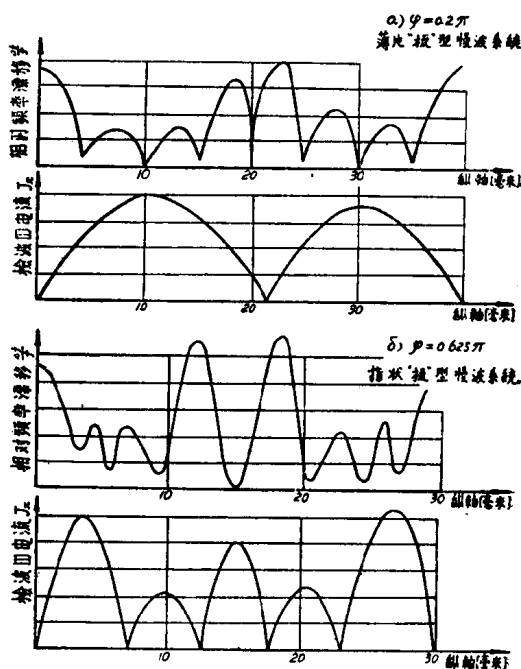


图 7 用扰动体测得的探针测试图 $\left(\frac{\Delta f}{f}\right)$ 和用横向探针测的探针测试图 (J_x) 的比较（从扰动体和探针的自由端到慢波系统的距离近似相等）。

* 卡普隆是一种聚酰胺纤维。

** 当问题涉及到精确场图的获得时，例如测量耦合阻抗时（见 § II—1），这些要求将变得更加严格。

能的。在节距约为数毫米的慢波系统中，上述要求实际上是很难完成的。应该指出，减少单元数目，会增大扰动体的作用（谐振失谐），因为作用的大小与整个空腔中所储存的能量成反比（见 § II-6 和 § I-8）。

对轴对称的慢波系统（例如膜片波导）来说情况要好一些，在这种慢波系统中在纵轴上仅有一个电场分量。这样就可能使用大直径的扰动体。

活动无功探针法的第二个特点与下述情况有关：在扰动体和有功探针端距周期结构有相等距离的情况下，扰动体的“电中心”距周期结构较近，因而，处于空间谐波较强的场内。在某些情况下这一事实会导致用无功探针法获得的基波电场分布的严重失真。图 7 所示是有功探针和无功探针测得的电场分布，测量时这两种探针距周期结构的距离近似相等。从图 7 中可以看出，在用无功探针测出的探针测试图上，由于“花瓣”破碎（因空间谐波的叠加所致），很难确定谐振模式。为了减少“破碎”程度必须将无功探针放在距指表面较远的距离上，因为在这种距离上空空间谐波的影响较弱。但是这只有用降低测量灵敏度的代价才能换取到。

§ I-4. 活动短路法

活动短路法*是以使用一个滑动短路活塞的方法为基础的，这种短路活塞法广泛地用于一般的波导测量技术中，主要的是用来测量四端网络的参量[16.17]。

短路活塞法的理论确定了两根彼此串联的无损传输线的相位常数之间的关系：

$$\operatorname{tg} \beta_1 (d_1 - d_{10}) = \frac{1+D}{1-D} \operatorname{tg} \beta_2 (d_2 - d_{20}) \quad (\text{I.10})$$

式中， β_1 和 d_1 分别为传输线 I（两个传输线连接处左侧的传输线）的相位常数和场从最小值到任意选择的截面（读数平面）的距离；

β_2 和 d_2 分别为传输线 II（连接处右侧的传输线）的相位常数和从短路平面到读数平面的距离；

d_{10} 和 d_{20} 分别为传输线 I 和传输线 II 的起始距离。

D 为在传输线 II 匹配情况下，传输线 I 中的反射系数的模。

如无反射，则 $D=0$ ，可把表示式 (I.10) 写成更简单的形式：

$$\operatorname{tg} \beta_1 \Delta d_1 = \operatorname{tg} \beta_2 \cdot \Delta d_2 \quad (\text{I.11})$$

式中， $\Delta d_1 = (d_1 - d_{10})$ ， $\Delta d_2 = (d_2 - d_{20})$ ，由此得出：

$$\beta_1 \Delta d_1 = \beta_2 \Delta d_2 \quad (\text{I.12})$$

这样一来，若已知一个传输线中的相位常数，在测量 Δd_1 和 Δd_2 之后，就可以确定另一传输线中的相位常数。假定，传输线 II 是一个慢波系统，其中的短路平面每次移动一个节距，即： $\Delta d_2 = L$ 。那么 $\beta_2 \Delta d_2$ 不是别的，而正好是相移 φ 。因此可以将 (I.12) 式写成下列形式

$$\varphi = \beta_1 \Delta d_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta \bar{d}_1 \quad (\text{I.13})$$

以上就是利用活动短路法来测定色散特性曲线的方法。

通常以测量线作为传输线 I，在测量线内根据短路位置测定最小值位置。为了消除测量线与慢波系统之间的反射，可接入阻抗匹配的装置，例如三短截线阻抗变换器。在匹配设备

* 有时也称为 S 曲线法或切线法。

调整后，慢波系统中应该仅有行波*。

短路活塞的形状取决于被测系统的结构特点。在指型系统的情况下，它可以是插入指间隙缝内并尽可能复盖系统整个横截面的导电性能良好的金属片，也可以将慢波系统放在介电常数较大的液体槽内，用液体的水平面作为活动的反射表面[13]。对于由一些部件组成的系统（如膜片波导），用逐渐增多部件的方法移动短路平面比较方便。

要使慢波系统匹配良好不是经常有可能的。但是这不是这种测量方法的原则性限制。从关系式(I.10)中很容易看出，如果 $D \neq 1$ ，则在左端幅角 $\beta_1(d_1 - d_{10}) = 0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}$ 等值的情况下，右端的幅角 $\beta_2(d_2 - d_{20})$ 也将具有同样的值。显然，两幅角之间的关系是一条形状很象字母 S 的周期曲线(图 8)。当把短路片每移动一个节距时，如果在匹配情况下 ($D = 0$)，最小点都产生相同偏移，而在失配 ($D \neq 0$) 的情况下，最小点的偏移则不同，但是在 S 曲线的一个周期（或半周期）上的总相移在两种情况下则是一样的。

将方程(I.12)改写成下列形式：

$$\Delta d_1 = \frac{\beta_2}{\beta_1} \Delta d_2 \quad (\text{I.12})$$

该方程式是一条直线，倾角的正切等于 $\frac{\beta_2}{\beta_1}$ 。这样，由实验作出一条 $\Delta d_1 = f(\Delta d_2)$ 的曲线并通过所得到的 S 曲线引一轴线，我们就可以确定该轴线倾角的正切： $\text{tg} \alpha = \frac{\beta_2}{\beta_1}$ (图 8)。知道了测量线的 β_1 ，就可以根据下列关系式很容易地求出 φ 值：

$$\varphi = \beta_2 \cdot L = \text{tg} \alpha \cdot \beta_1 \cdot L = \frac{2\pi L}{\lambda} \text{tg} \alpha \quad (\text{I.14})$$

如果失配现象不十分严重，则不必作出 S 曲线，而在大量的指上求 (I.13) 式中 Δd_1 的平均值就可以获得相当精确的结果，因为在平均的情况下， Δd_1 值向较大或较小方面的偏离

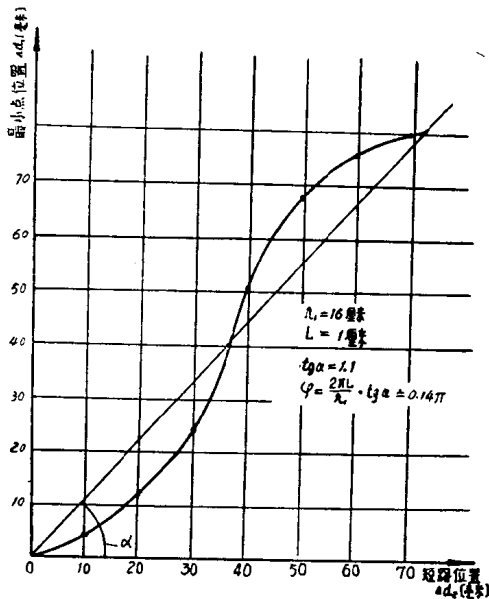


图 8 按公式(I.14)求相移的图解。

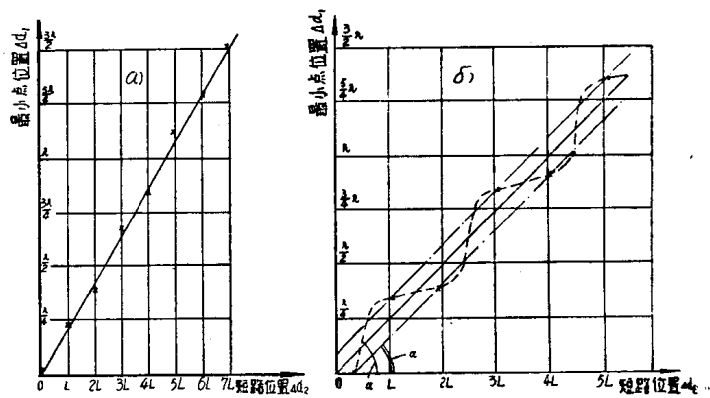


图 9 S 曲线的轴线的确定：a) 失配不严重的情况—S 曲线的轴线在实验点间通过；b) $\varphi = 0.5\pi$ 和失配较严重的情况—S 曲线的轴线平行于实验点的连线 (L —慢波系统的节距)。

* 匹配慢波系统的方法在第三章中叙述。

大致都是相等的。

必須注意到，在作 S 曲綫时，在相移較大的情况下 ($\varphi = 0.5\pi - \pi$)，在曲綫的每一个周期上，仅能得到 1—3 个点。

在失配不严重 (S 曲綫的幅度較小) 的情况下，为了求出 $\text{tg}\alpha$ 之值，可以在实验点之間作一条直綫 (图 9 a)。在失配比較严重 (S 曲綫的幅度較大) 的情况下，特别是在相移較大时要較精确地作出一条直綫是很困难的。但是，在 $\varphi > 0.6\pi$ 的情况下，如果确定 Δd_1 时，将探針迎着短路活塞运动的方向移动，則可以在一个周期上获得数量較多的点。現在我們来研究一下测量綫中的駐波图形 (图 10 中的实綫)，該图相应于短路活塞的起始位置。将短路活塞移动一个結構周期时，駐波图形也产生移动 (图 10 中的虚綫)。

如果相移較大，則最小点的偏移也大 (图 10 所示之 Δd_1)，那么，在 S 曲綫的一个周期上仅可能得到 1—2 个点 (图 11 a)。但是在离开起始最小点 (最小点 I) 的另一方向上，在 $(\lambda/2 - \Delta d_1)$ 的位置处，有另一个最小点。不难确信，最小点这个偏移相应于相移 $(\pi - \varphi)$ 个弧度。

这样一来，我們就用較小相位角 $(\pi - \varphi)$ 的测量代替了較大的相位角 φ 的测量；这时，在 S 曲綫的一个周期上就可以得到为作 S 曲綫所需的相当数目的点 (图 11 b)。

为了計算 φ 值写出下列方程式：

$$\varphi = \left(1 - \frac{2L}{\lambda} \text{tg} \alpha'\right) \pi, \quad (I.14a)$$

式中 α' 为 S 曲綫的軸綫对横坐标軸的傾角 (图 11 b)。

在相移接近 0.5π 的情况下，这种方法已告无效。此时可以利用这样一种情况，即根据对称性，所有点应该位于 S 曲綫之軸綫的两侧并与其平行的两条直綫上 (图 9 b)。

为了比較起見在表 1 上給出了利用活动短路法和活动有功探針法测量相移的一些結果。从表中可以看出，这些結果之差平均不超过

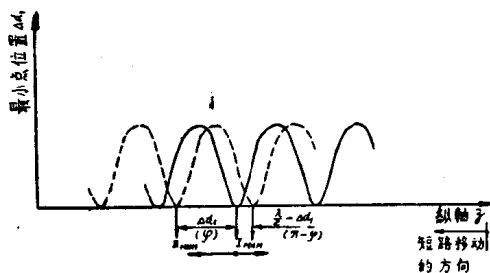


图 10 移动短路平面时测量綫中駐波图的移动

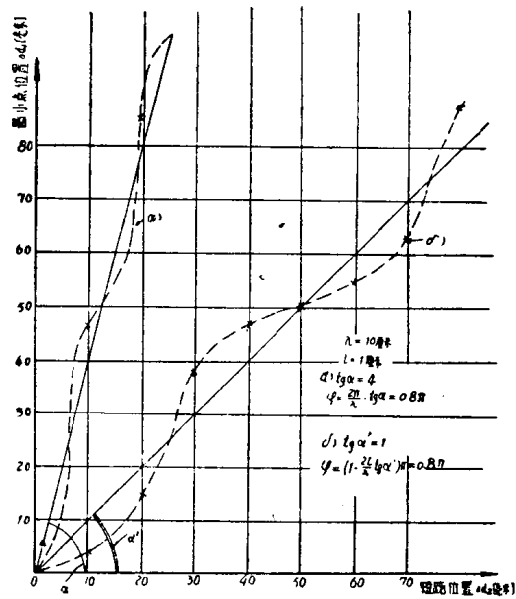


图 11 与探針移动的两个相反方向相应的两个 S 曲綫的比較：a) 探針和短路同向移动；b) 探針和短路反向移动

5—7%，显然，它沒有超出测量精度的范围。

测量誤差主要是取决于作 S 曲綫的精确度。在匹配良好的情况下，誤差与相移无关，而在失配的情况下 (如上所述)，則与相移有关，当相移無論是从大的，还是从小的方面接近 $\varphi = 0.5\pi$ 的点时，誤差均会增大。

表 1

慢波系 統类别	序 号	λ (厘米)	φ_1 (弧 度) 活动短路法	φ_2 (弧 度) 活动有功探针法	$\frac{(\varphi_1 - \varphi_2)}{\varphi_{cp}} \cdot 100\%$
“交叉指” 型慢波系 統	1	7	0.35	0.33	5.9
	2	7.5	0.44	0.41	7.
	3	8	0.51	0.49	4
	4	9	0.61	0.625	2.4
	5	10	0.705	0.73	3.5
	6	11	0.79	0.82	3.7
	7	12	0.85	0.885	4.1
“梳” 型慢 波系 統	1	9	0.44	0.395	10.5
	2	10.5	0.21	0.19	10
	3	11.5	0.15	0.135	10

由于最小点的位置测定得不精确而造成的誤差不十分显著。在通頻带边缘附近，誤差应该有所增大，因为在这种情况下，获得的 Δd_1 值較小。在通頻带的边缘附近，由于慢波系統中的衰减而产生附加誤差，这是因为只有在传输綫中沒有损耗的情况下短路活塞方法才是完全正确的。

产生誤差的另一个原因可能是由于在短路平面內存在有阻抗的有功分量（由于接触損耗，輻射損耗或其它原因）。在电路內的連接元件和匹配元件也可能产生損耗。可以根据測量綫上的电压駐波系数，估計損耗的存在和大小（电压駐波系数的值越大，損耗越小，反之亦然）。

慢波系統尺寸的不均匀性也会降低測量精度，这主要是因为短路平面位置的偏差和損耗的增加所致。

§ 1-5. 諧 振 法

測量色散特性曲綫最快的方法是粗略的測定所有振盪模式的諧振頻率的方法。知道了色散的性質和单元数目，就可以按以下公式求出振盪模式的相移：

$$\varphi = \frac{n}{N} \pi,$$

式中的 n 对于首尾相接的系統取偶数数值 2, 4, 6... N ；对于非首尾相接的系統取整数数值 1, 2, 3, 4, 5... N 。

然而，这种測量方法只有对那些色散曲綫沒有弯曲或通頻带不非常靠近的最簡單慢波系統才是适用的。属于这类慢波系統的有大多数单阶慢波系統和一些最簡單的双阶慢波系統（“交叉指”型，对环式（встречные бугели）等）。

諧振可以用各种不同的方法来測定，四端网路电路的測量方法可以认为是最簡單的。这种四端网路电路無論是在能量輸入端，还是在接指示裝置的輸出端，均应具有非常弱的耦合。在采取相应的措施（如选用导电性能良好的材料，对表面进行精細加工等）来提高被測系統的品质因数时，就可以得到非常高的測量精度。因为諧振法不需要使用探针，所以慢波系統的模型可以完全封閉，这样就可消除由輻射而引起的損耗，与活动有功探针法相比，可以更精确地測定諧振。

这种测量方法严重的缺点是：第一，不能确定色散的性质；第二，为了获得色散特性曲线必须找出所有谐振模式的谐振频率。有时由于各种原因，要做到这一点是很困难的，甚至是不可能的。

为了保证最大的简便性和可靠性，建议在测量时选用单元数目不太大的系统。最适宜的单元数目应认为是 10—20（根据预计的通频带决定）。

§ 1-6. 测量色散特性曲线的各种不同方法的比较及其应用范围

毫无疑问，活动探针法（有功的和无功的）是最直观和可靠的测量方法。它能够同时给出关于沿系统场分布的某些概念。这两种方法的共同缺点是：场的分布有可能产生上述的失真，以及必须具有专用设备，如果用于各种不同类型的慢波系统和各种不同的频率范围，则很难做出适合于各种情况的通用设备。在一切有可能的情况下，最好采用有功探针法，因为，用有功探针能较容易和较精确地分离出一个唯一的场分量。同时还须指出，有功探针法和无功探针法之间的一个本质区别：有功探针能反应场的有效值，该值在通过系统的功率恒定时与单元数目无关。

无功探针法的灵敏度取决于因谐振腔失谐而引起的电场强度的变化。同时，失谐的程度取决于场平方 E^2 与空腔中储能 W 的比值（见本章第 8 节）。由于 W 值与空腔长度成正比，故由此得出，单元数目越少，此测量方法的灵敏度就越高。此外，无功探针法的灵敏度与被研究谐振腔的品质因数有密切的关系。有功探针法原则上是没有这些缺点的，因为由谐振腔中的损耗而引起的谐振强度的降低，可以用增加信号电平，或者增加指示器灵敏度的方法来补偿。

在圆柱形慢波系统的模型中移动有功探针比在平面形系统中简单，因为用平面形模型时必须除去一个壁，或者是在壁上开一隙缝。转动探针与将探针来回移动相比，也是较容易实现的。与此相反，无功探针用到平面形系统中比较简单。借助有功探针能够测量节距非常小（1 毫米）的系统，因为探针直径能够作得远小于节距。这一点对于波段较短的系统的测量是有很意义的。场分布的测量过程较容易实现自动化（见第 7 节），这也是活动探针法的优点之一。此外，探针法能够非常容易和相当快地确定通频带的宽度。

在研究复杂的慢波系统，如具有复杂的色散特性的多层和多排慢波系统 [19, 20] 时，这些方法是不可缺少的。至于活动短路法，则具有一系列缺点和局限性：

1. 直观性较差，所给出的场分布资料较少；
2. 无论是在测量工作方面（手工），还是在测量结果的处理加工方面，其工作量都是比较繁重的；
3. 通常要求使用专门的匹配装置；
4. 在小节距和细指（薄片）的圆柱形模型的情况下，很难实现良好的活动短路。

这种测量法的优点是，能够用很精密的设备（如测量线）确定相移，以及“快”谐振模式的影响较小。

活动短路法可在不具备用探针进行测量的专用测量设备的情况下使用。在怀疑场“花瓣”数目是否数得正确时，也可以用活动短路法来验证。此外，系统中波长的确定是用 S 曲线法（见第三章）研究均匀线和慢波系统之间转换接头（变换器）特性的附带结果。

諧振法也有許多严重的缺点:

1. 不能确定色散的性质;
2. 必須找出所有的振盪模式, 而在用其他的方法时, 仅在通頻带中感兴趣的部分上进行測量就可以了;
3. 只能用于最简单的慢波系統类型;
4. 沒有給出場分布的特性;
5. 在通頻带上出現附加的“多余”諧振时, 这种方法便不精确或者是完全不能使用。

除以上这些缺点以外, 諧振法也有一些优点。第一, 諧振法不需要专用的測量設備; 第二, 測量工作量不很繁重; 第三, 在条件良好的情况下, 可以保証較高的測量精度。

实际上, 諧振法可以用来成功地研究当几何尺寸有些变化时对各种已知慢波系統参量的影响。將諧振法与活动探針法配合起来可以保証測量既有最高精度又有最大可靠性。

§ I-7. 通頻带边界的測定

在某些情况下有可能产生用实验方法測定通頻带边界的必要性。但是, 实际解决这个問題是一件相当复杂的任务, 其原因如下: 第一, 靠近通頻带边界处的色散很强。因而, 在接近截止頻率时, 系統尺寸的不均匀性即使是不太大的时候, 也会造成很大的損耗。于是就形成这样的結果, 在实际的系統中, 边界經常是“模糊的”(Размазанный)。第二, 在 $\varphi = \pi$ 的情况下, 第一次空間諧波的振幅变得与基波的振幅相等。第三, 在截止頻率区域内, 由于强烈的幅射, “快”振盪模式强烈的自激現象是經常有的[13]。如果沒有“快”模式的干扰, 則借助于活动探針, 根据場分布显著衰减現象出現的时刻, 就可以大致測定通頻带的边界 (图 12 a)。如果单元数目不太大 ($N = 4 - 10$), 則用諧振法有时可以相当精确地确定截止頻率。而单元数目較大时情况就复杂得多。

測量截止頻率的非常可靠的方法目前尚不知道。但是可以指出一些方法, 这些方法有助于进一步明确截止頻率的范围。其中之一是在慢波系統上接一測量綫并二次測量靠近通頻带边界处的电压駐波系数, 第一次在系統尽可能匹配时进行, 第二次在系統严重失配时进行。这两条曲綫的叠加 (图 12, б) 將給出根据負載影响存在与否来确定截止頻率的可能性。

第二个方法[13]是在慢波系統和測量綫之間接入一个可調的匹配变换器, 借助于該变换器在接近通頻带边界 λ_1 的頻率上进行匹配。然后在进行匹配的頻率附近測量电压駐波系数与波长之間的关系曲綫 (示于图 12 в)。然后在更接近边界 λ_2 的頻率上进行匹配, 并作出同样的曲綫。重复該过程, 直到获得当离开所匹配的波长向截止波长接近时电压駐波系数急剧上升的曲綫为止。檢驗結果表明, 該方法不是完全可靠的, 它仅給出了測定截

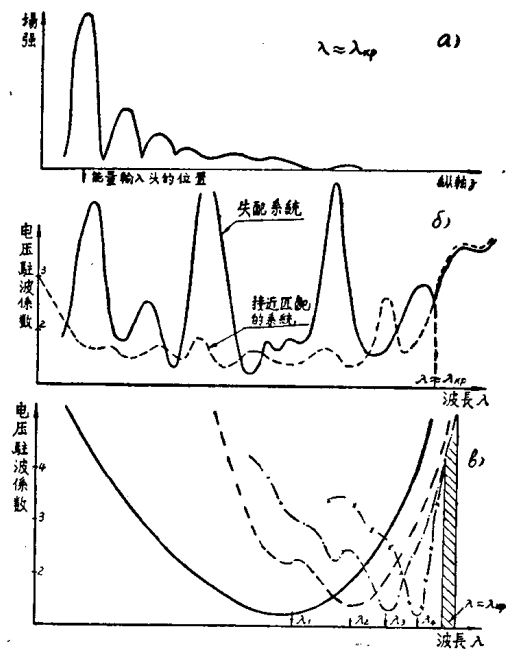


图 12 通頻带边界的确定: a) 根据場的衰减; б) 根据系統匹配和失配时的电压駐波系数的比較; в) 根据宽带匹配 ($\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ ——系統匹配时的波长)

止频率区域的可能性。

最后，第三种方法[21]是借助于某种带晶体检波器的指示器，测量慢波系统开口端的辐射强度。在通频带边界附近，辐射强度发生急剧的下降（实际上一直降到零）[21]。

§ 1-8. 研究慢波系统中场分布的方法

在本章第1节中已经指出，详细地了解慢波系统中场分布的情况具有非常大的实际意义。

某些最简单的测量可以借助于普通探针来完成，如直的细丝状电探针和尺寸不大的环形磁探针。在具有相应的设备时（见本章第9节），利用这些探针就可以测定电场或磁场的某一分量沿 z 轴（ y 座标轴取不同值时）和 y 轴（ z 座标轴取不同值时）的分布情况。但是，探针测得的场的相对值是沿 x 座标的平均值，这是由于探针在这个方向上具有一定的长度。正是由于这种原因就不可能利用探针沿 x 轴移动的方法来测定场沿该轴的分布。

在文献[22]中介绍了一种借助于平衡电偶极子在放大的螺旋慢波系统模型（平均直径33.8毫米，节距9.17毫米）中研究场分布的方法。如果偶极子是理想对称的，则它仅对沿其轴线指向的场分量有反应，因为由另外两个场分量在偶极子的两个支臂上所产生的电流相互抵消。偶极子探针在测量技术中之所以没有获得广泛的应用，主要是由于使其平衡的复杂性。在文献[22]中曾采用了一个小的气体放电管（直径4.5毫米）作为测量相对场强的探针。但是用这种探针的测量过程相当繁杂。近几年来在超高频测量技术中获得了广泛应用的微扰法是比较完善的方法[10, 11, 12, 23]。这种方法的基础奠定于I. Müller, L. C. Maier, J. C. Slater和其他作者的一些有重大价值的文献之上[24, 25, 26]。微扰法的理论及其实际应用问题在B. П. Саонов等人的报告[12, 27]中有详细的叙述。下面简短地介绍一下该方法的实质。大家知道，在谐振的空腔内，电能量与磁能量的平均值是相等的，即： $W_E = W_H$ 。当在空腔内加入某一种扰动（体积 δv 或是介质常数 $\delta\epsilon, \delta\mu$ ）时，则在频率 f_0 上的能量平衡就被破坏。为了恢复能量平衡就必须将频率 f_0 改变 Δf 。对于小扰动，理论上确立了体积或介质常数的改变和因此而引起的频率变化之间的联系为：

$$2W\Delta f = -f_0 \left[\left(\int_{\Delta v} \delta\mu H^2 dV + \int_{\Delta v} \delta\epsilon E^2 dV \right) - \left(\int_{\delta v} \mu H^2 dV - \int_{\delta v} \epsilon E^2 dV \right) \right], \quad (1.15)$$

式中， W 是谐振时空腔的体积 v 中的储能；

E 和 H 是电场和磁场的有效值；

δV 是体积的变化；

Δv 是介质常数发生变化的体积。

这就是微扰理论的基本公式。在空腔内引进金属体等效于体积变化了 δV 。从公式(1.15)中看出，在电场较强的地方放一块金属体，就会引起谐振频率的减小。如果将该物体放在磁场较强的地方，则谐振频率便增加。使用该方法测量场分量的可能性是以下列两个主要假设为基础的：

1. 放入扰动体后被研究空腔的场结构不发生变化；
2. 扰动体应小到这种程度，以至于可以认为在其附近的场是均匀的。